

표면분석실 사용료 안내

※ 시행일자: 2018. 07. 01.부

예약확정 후 미분석 3회 누적 시 다음 한달 해당장비 이용불가.
자세한 사항은 각 장비담당자 문의바랍니다.

장비명	세부내역		분석료(원)	
			교내	교외
HP-Powder XRD (고출력 분말용 X-선 회절분석기)	측정	기본료(30분/시료, 4kW)	40,000	60,000
		출력 1kW 증가시	10,000	20,000
	결과처리 (기타특수기능은2배)	정성분석/시료당	25,000 (50,000)	25,000
	추가 데이터처리	요청/시료	10,000	10,000
HP-Thin Film XRD (고출력 박막용 X-선 회절분석기)	측정	기본료(30분/시료, 6kW)	40,000	60,000
		출력 1kW 증가시	10,000	20,000
	결과처리 (기타특수기능은2배)	정성분석/시료당	25,000 (50,000)	25,000
	추가 데이터처리	요청/시료	10,000	10,000
TOF-SIMS (이차이온질량분석기)	기본료	진공 및 전처리	100,000	160,000
	표면분석	Point별 (표면, 결과처리, 이미지)	75,000	120,000
		Point별 (깊이, 결과처리, 이미지)	100,000	160,000
	profiler 사용시 추가		40,000	60,000
HR-AFM (고분해능 원자힘현미경)	기본	1 point	24,000	49,000
		초과시(Point 당)	24,000	49,000
Profiler (낙차 측정기)	기본	Point별(30분)	22,000	44,000
		초과시(30분당)	22,000	44,000
XPS (엑스선 광전자분광기)	XPS/AES	표면분석(Point별 30분당)	70,000	120,000
		깊이별분석(Point별 시간당)	140,000	250,000
	UPS, REELS, 특수기능	표면분석(Point별 30분당)	120,000	200,000
	추가기능	표면 cleaning	25,000	40,000
Bio-AFM (바이오원자힘현미경)	기본	2point, 1hr(준비시간 포함)	40,000	80,000
		초과시(Point 당)	20,000	40,000
		Tip등 소모품 지참필요		
Mask Aligner (마스크정렬노광기)	기본	시료당(20분)	30,000	교내만
		시간당	100,000	사용가능